## испытания и

### КОНТРОЛЬ

#### Перечень оборудования

1. Микроскоп сканирующий трансмиссионный STEM, модель Hitachi HD-2000,





Год производства: 2001

Ускоряющее напряжение 200Кв

Разрешение 0,24nm

Детекторы TE, SE, Z-contrast (TE in Dark field)

В рабочем состоянии.

Цена 9 000 000 руб. Транспортировка и упаковка в стоимость не входит.

2. Микроскоп сканирующий трансмиссионный STEM, модель Hitachi HD-2000,



Год производства: 2003

Ускоряющее напряжение 200Кв

# испытания и

### КОНТРОЛЬ

Разрешение 0,24nm Детекторы ТЕ, SE, Z-contrast ( TE in Dark field) Отсутствуют декоративные крышки и стол. Полностью рабочий. Цена 6 500 000 руб. Транспортировка и упаковка в стоимость не входит.

#### 3. Микроскоп электронный сканирующий Hitachi S-4800





Год производства: 2008

Ускоряющее напряжение: 30Кв

Разрешение: 1.0nm

Детекторы: TE, SE, Upper Se, YAG BSD Bruker EDS с безазотным детектором

#### В рабочем состоянии.

Цена 25 000 000 руб. Транспортировка и упаковка в стоимость не входит.

#### 4. Система травления фокусированным ионным лучом Hitachi FB-2000



Год производства: 2001

Ускоряющее напряжение: 30Кв

Разрешение: 3.0nm

Эмиттер: Ga Детекторы: SE

В рабочем состоянии. Использует стандартный

для HD-2000 держатель образцов

## испытания и

## контроль

Цена 4 500 000 руб. Транспортировка и упаковка в стоимость не входит.

#### 5. Ультратом Leica Ultracut





Комплект - Ультратом Reichert /Leica Ultracut S, пила и скалыватель стеклянных ножей. Полностью рабочий Цена 1 000 000 руб.

#### 1. Система пробоподготовки для TEM и STEM LEICA EM AC20



Цена 900 000 руб.